

WORKSHOP & RÉUNION DES UTILISATEURS FRANCOPHONES ToF-SIMS (ION-TOF) 14 et 15 Mars 2019 - Bordeaux - PLACAMAT

PROGRAMME

Jeudi 14 Mars Après-Midi

Lieu du Workshop:

Centre de Recherche Paul Pascal (PESSAC)

Amphithéâtre

Entrée via Allée Paul Pascal

14H00 **Accueil – Prise de badge**

14H30 **Atelier ION-TOF**

Julia Zakel, ION-TOF Munster (D)

SurfaceLab 7.0 : A Giant step forward in the way we work with ToF-SIMS data

- *New features of SurfaceLab 7.0 including the « interactive Data Analysis »*
- *Introducing the new data format: Conversion of old data, cloning of data views, ...*
- *How to use all the corrections with the new format : Mass shift correction, Advanced ToF-correction, EDR, ...*
- *Open discussion for questions*

16H30 – **Prise de badge – Pause Café**

17H00 **Visite des installations Placamat**

18H00 **Transfert vers hôtel**

19H30 Dîner (sur réservation)

Hôtel et Restaurant:

Hôtel Mercure Gare Saint Jean Bordeaux

28-30 rue de Tauzia

33800 Bordeaux

Tel : 05.56.92.21.21

Avec le soutien de :



WORKSHOP & RÉUNION DES UTILISATEURS FRANCOPHONES ToF-SIMS (ION-TOF)

14 et 15 Mars 2019 - Bordeaux - PLACAMAT

PROGRAMME

Vendredi 15 Mars Après-Midi

Lieu de la réunion:
Centre de Recherche Paul Pascal (PESSAC)
Amphithéâtre
Entrée via Allée Paul Pascal

08H30 Accueil – Prise de badge

09H15 : **Introduction et Informations**
A. Galtayries, SFV/Chimie ParisTech

09H20 : **Le ToF-SIMS un outil de plateforme pour la caractérisation des matériaux**
J-P. Salvétat, PLACAMAT, Bordeaux

09H50 : **Evolution of the Bi cluster LMIS as a universal source for high performance SIMS analysis**
F. Kollmer, ION-TOF, *Conférence Invitée*

10H20 : **Liaisons chimiques à l'interface d'aluminium et de polyamide après soudure laser**
P. Hirchenhahn, NISM, LISE, Université de Namur

10H40 : Pause

11H00 : **Clusters for organic and hybrid thin film analysis: new challenges and opportunities**
A. Delcorte, Université Catholique de Louvain la Neuve, B, *Conférence Invitée*

11H30 : **Light-induced protein adhesion on PLL-g-PEG coatings: a molecular surface characterization**
A. Galtayries, IRCP, Chimie ParisTech

11H50 : **Informations candidature La Rochelle à SIMS XXIV**

A. Brunelle, SFSM/Laboratoire d'Archéologie Moléculaire et Structurale, Sorbonne Université, Paris

12H00 : Déjeuner avec les compliments d'ION-TOF

14H00 : **Advanced semiconducting structure analysis with Self-Focusing SIMS and improved mass resolution in a Hybrid SIMS instrument**
A. Franquet, IMEC, *Conférence Invitée*

14H30 : **Titre à définir**
V. Spampinato, IMEC

14H50 : **Laboratory flames under investigation: finding trends in soot nucleation and growth when secondary ion mass spectrometry meets statistical analysis**
A. Faccinnetto, Université de Lille

15H10 **Plateforme Andromède, les premiers résultats en MeV Nanoparticules-SIMS**
S. Della Negra, Institut de Physique Nucléaire d'Orsay

15H40 : **Conclusions de la réunion**

Avec le soutien de :

